

平成 18 年 5 月 29 日

各 位

上場会社名 株式会社ノア
(コード番号：3383 名証セントレックス)
本社所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号
代表者 代表取締役社長 田平博志
問合せ先 取締役管理本部長 島田零三
TEL (03) 5423-6711 (代表)

クリーデンス社製の半導体向け検査・解析・FIB装置を販売開始

株式会社ノア(本社：東京都渋谷区、社長：田平博志、以下ノア)は米国・Credence Systems Corporation(本社：米国 カリフォルニア州、CEO 兼社長：David A. Runhoff、以下クリーデンスシステムズ社)と EmiScope (タイミング解析装置)、OptiFIB (表/裏面回路修正用フォーカスイオンビーム システム)、P3X-III (表面回路修正用フォーカスイオンビーム システム)、GlobalScan (レーザーインジェクション IC 不良特定装置)、i-demi (エミッション顕微鏡)の日本における販売代理店契約を締結し、当該製品の国内販売を 2006 年 6 月より開始いたします。

クリーデンスシステムズ社の EmiScope は、トランジスタの動作タイミングを測定し、半導体デバイスの不良原因を解析して、その改善に威力を発揮いたします。また、同社の OptiFIB と P3X-III は収束イオンビームを用いて 65nm 世代の半導体デバイスの回路不良を修正することが可能であり、今後の 45nm 世代のデバイスに対応できる取組みも現在なされております。同社の GlobalScan はレーザー照射により発生する抵抗差を高感度アンプで検出し、半導体デバイスの不良箇所特定を行うことが可能です。また、同社の i-demi はデバイスの不良箇所から発生するフォトンを高感度センサーで捕捉し、不良箇所の特定を行うことが可能です。

これらの装置を利用することで、半導体デバイス解析における現在の解析フロー及び工数の軽減と効率化を大幅に図ることが可能となり、LSI の内部非破壊不良解析など多岐に亘る利用が見込まれております。ノアは、この製品の販売の開始により、お客様へ提供できる半導体解析ソリューション商品のラインアップを大幅に拡充することができます。

ノアでは、これらの製品の国内売上につきましては、2007 年 6 月期に 5 億円を見込んでおり、2010 年 6 月期には 15 億円の売上を目指しております。

【クリーデンスシステムズ社について】

世界的な半導体検査・解析装置メーカーです。従来は LSI, アナログ/ミックスド・シグナル LSI, 不揮発性メモリ (フラッシュ・メモリ) 向けなどの小型で低コストハイパフォーマンスなテスターを主製品としておりましたが、2004 年の NPTest 社の買収でシステム LSI や CPU 向けのハイエンドテスター群をラインアップに加え、ロー、ミドル、ハイクラス全ての分野のテスターを供給しております。同時に、プローブシステムと呼ばれる解析装置群も製品ラインアップに加え、現在は Diagnostic Characterization Group(DCG)と呼ばれる、タイミング解析装置 (Emi-Scope)、回路修正 FIB (OptiFIB, P3X-III)、エミッション顕微鏡などを主に販売する企業です。

設立 : 1978 年

本社 : 米国カリフォルニア州

売上 : 2005 年 42,932 万ドル

上場 : NASDAQ 市場

Chief Executive Officer and President : David A. Runhoff

詳細につきましては、ウェブサイト (<http://www.credence.com>) をご覧ください。

以上